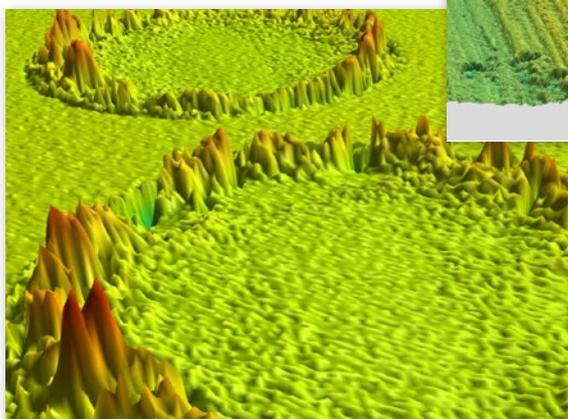
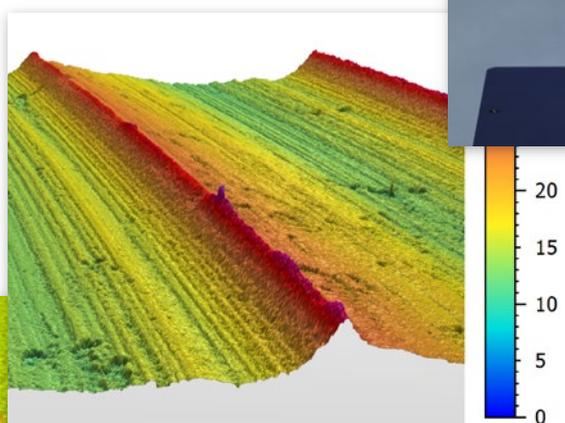


SPA 25

Измерительная система
для анализа поверхностной топографии
и определения параметров шероховатости

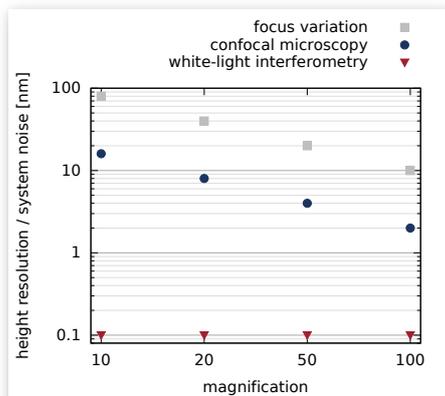


Анализатор профиля поверхности SPA 25

Отличительными характеристиками анализатора профиля поверхности SPA 25 является измерение поверхностной топографии и параметров шероховатости с исключительной быстротой и точностью.

Высокая разрешающая способность измерения

SPA 25 использует метод интерферометрии белого света, который отличается высоким разрешением до 0.1 нм даже при использовании небольшого увеличения. Это даёт SPA 25 суще-

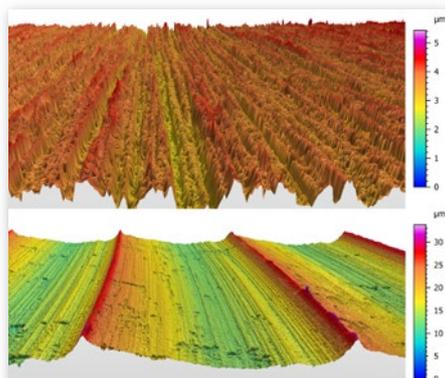


Вертикальное разрешение / помехи для различных значений увеличения и измерительных техник

ственное преимущество перед приборами, работающими по принципу переменного фокусного расстояния или конфокальной микроскопии.

Автоматический предметный столик

Столик с электроприводом перемещает образец под измерительной головкой, и после каждого измерения все изображения состыкуются вместе для последующего анализа поверхности площадью до 300 мм x 300 мм.



Поверхностные профили эталонов шлифовки и фрезеровки



Измерительная головка с автоматическим столиком, джойстиком и контролером SPA 25

Передовое программное обеспечение

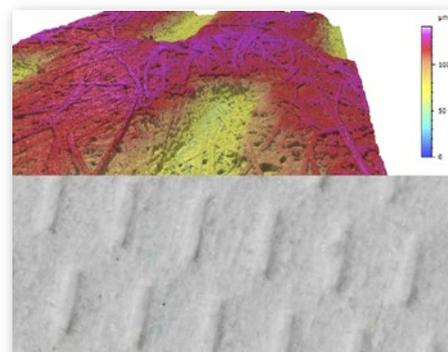
Для анализа профиля поверхности SPA 25 использует программное обеспечение *MountainsMap® Imaging Topography*. *MountainsMap®* может рассчитать параметры шероховатости в соответствии с международными стандартами ISO 25178, ISO 4287, ISO 13565, ISO 16610 и другие.

Широкая область применения

Благодаря, исключительно высокому разрешению, скорости анализа и программному обеспечению с интуитивным интерфейсом, SPA 25 может быть использован для решения широкого спектра задач.

SPA 25 используется для создания 3D-карты поверхностей и выявления дефектов, вызванных обработкой материала.

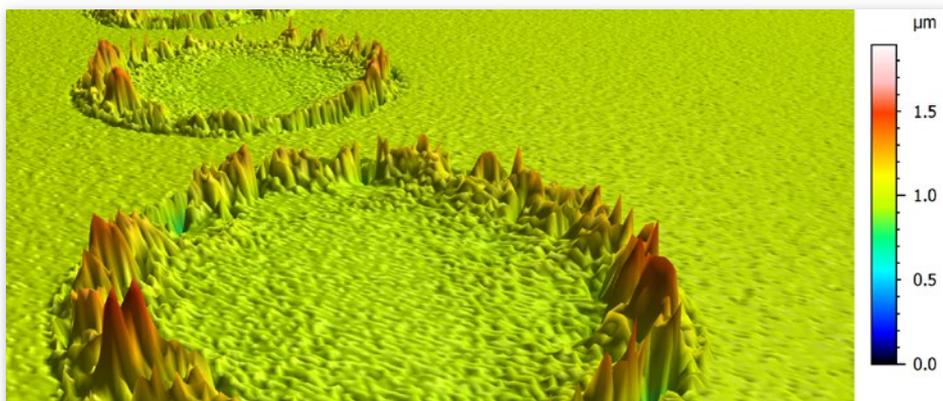
Совместное использование SPA 25 и оптического анализатора серии OCA позволяет определить значение



Профиль поверхности визитной карточки на тиснёной бумаге

краевого угла с поправкой на шероховатость поверхности по теории Венцеля.

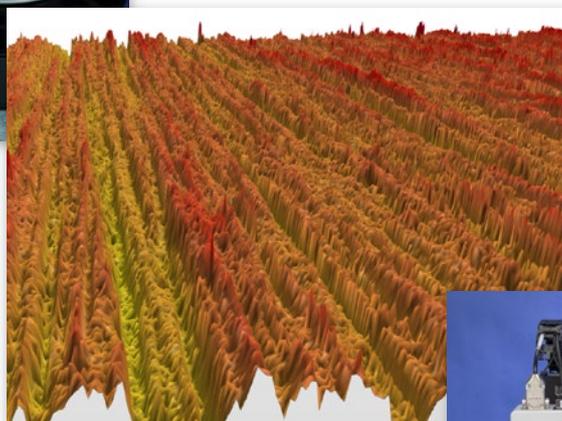
Высокое разрешение метода позволяет изучать структуру из микрочастиц, которые образовались в результате нанесения на субстрат пиколитровых капель чернил.



Поверхностный профиль высохших пиколитровых капель серебряных чернил

Технические параметры

Метод измерения сканер глубина сканирования (ось Z) скорость сканирования при полном разрешении	интерферометрия белого света пьезоэлектрический привод с регулированием высоты перемещения до 400 мкм 11.3 мкм/сек					
Тип сканирования разрешение по высоте (ось Z)	вертикальная сканирующая интерферометрия 1 нм			расширенная фазовая интерферометрия 0.1 нм		
Камера макс. разрешение макс. скорость записи	высокоскоростная камера USB 3 1920 x 1200 пикселей при 170 кадров/сек до 3000 кадров/сек при ограниченном ROI					
Объективы увеличение область измерения (X [мм] x Y [мм]) рабочее расстояние [мм] расположение точек [мкм]	объективы Мירו для интерферометров					
	2.5x	5x	10x	20x	50x	100x
	7.3 x 4.6	3.7 x 2.3	1.8 x 1.2	0.91 x 0.58	0.37 x 0.23	0.18 x 0.12
	10.3	9.3	7.4	4.7	3.4	2
	3.8	1.9	0.96	0.48	0.19	0.1
Предметный столик площадь перемещения (X [мм] x Y [мм]) разрешение перемещения допускаемая нагрузка	ручной	авто	авто	авто	авто	авто
	73 x 55	75 x 50	100 x 100	150 x 150	200 x 200	300 x 300
	-	10 нм	10 нм	10 нм	10 нм	10 нм
	1 кг	1 кг	2 кг	3 кг	3 кг	5 кг
Штатив измерительной головки быстрое регулирование по оси Z тонкое регулирование по оси Z регулирование наклона	ручное юстирование по оси Z 70 мм 1.9 мм ± 3°					
Контроллер рекомендуемые требования ПК контроллеры аппаратного обеспечения	стандартная рама на 19" ; 3 единицы высоты Intel® Core™ I5, 16 GB RAM, 500 GB SSD, графическая карта NVIDIA®, Microsoft® Windows™ 10 Pro пьезоконтроллер, контроллер света LED, контроллер осей X и Y					
Программное обеспечение	сканирующее программное обеспечение SPS 25 & программное обеспечение для расчётов MountainsMap® Imaging Topography					
Стандартные методики и параметры параметры шероховатости, отнесённые к площади (ISO 25178) параметры шероховатости по профилю (ISO 4287)	в соответствии с ISO 25178, ISO 4287, ISO 13565, ISO 16610, etc. Sq, Sp, Sv, Sz, Sa, S10z Rq, Rp, Rv, Rz, Ra					
Габариты (L [мм] x W [мм] x H [мм]) Вес [кг]	измерительная головка и автоматический столик (75 x 50) 360 x 260 x 450 15.5			контроллер 500 x 515 x 210 20		
Источник питания	230 VAC; 50 Hz; 150 W					



Для получения более полной информации о нашем оборудовании, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием рассмотрим ваш запрос и предложим оптимальную конфигурацию прибора для решения Вашей задачи.

DataPhysics Instruments GmbH • Raiffeisenstraße 34 • 70794 Filderstadt, Germany
phone +49 (0)711 770556-0 • fax +49 (0)711 770556-99
sales@dataphysics-instruments.com • www.dataphysics-instruments.com

Контактное лицо: